

外国製半導体の認定試験はすべて、海外品質・信頼性規格（JEDEC, IEC, AEC等）の海外標準に基づいて実施されています。従って、ユーザー様、独自の社内標準とずれています。TAQSは不足する評価、条件の異なる評価等を、改めて、評価するサポート、及びユーザー様の実用条件での量産性評価をサポートしています。

採用認定試験



ES評価



量産開始



変更管理（1）
工場移管



変更管理（2）
工程改善変更



生産中止品の
品質・信頼性
サポート

- * 信頼性評価でリフロー前処理ストレスがJEDECと違い、緩い。
- * ESDSデータが Go、No-Goで破壊値がわから無い。
- * L/A評価が、社内標準と異なる、実機ベースとも違う。
- * サンプル数がことなる。

- * 実機ベースでの動作評価・動作寿命評価
- * はんだ付け性評価の使用、はんだの素材成分/フラックスが違う。
- * はんだ付け性評価（フィレット、ボイド、濡れ性）
- * サンプル数がことなる。

- * 受け入れ検査代行（テスター検査、実機Func、ASO、Ronランク分け）
- * 初期流動品質管理（特性評価・初期バーイン・良品解析等）
- * 定期品質・信頼性モニター
- * 初期不具合解析・Keepサンプルとその解析

- * 工場移管に伴う・品質評価/認定試験・背反確認
- * 前後品の良品解析（構造確認・工程品質・工程能力比較調査）
- * 変更前後品を用いた、実機特性評価・品質信頼性評価）
- * 変更品の初期流動品質・信頼性評価/変更品初期バーイン）

- * 工程変更に伴う・品質評価/認定試験・背反確認
- * 前後品の良品解析（構造確認・工程品質・工程能力比較調査）
- * 変更前後品を用いた、実機特性評価・品質信頼性評価）
- * 変更品の初期流動品質・信頼性評価/変更品初期バーイン）

- * 長期間中止品使用の場合、ウエファー預り、都度、再生品納入
- * 長期在庫品の品質・信頼性確認・検証
- * はんだ付け性能の維持管理保管
- * Smart E. O. L プログラムで保守品供給
- * 不具合解析・流出防止スクリーニング・バーイン

